

Микроскоп электронный растровый JSM-7001F	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>39763-08</u>
--	---

Изготовлен по технической документации фирмы «JEOL», Япония,
заводской №SM18550065

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микроскоп электронный растровый JSM-7001F предназначен для количественного морфологического анализа и измерения линейных размеров микрорельефа поверхности твердотельных структур.

Микроскоп применяется в материаловедении, микроэлектронике и полупроводниковых технологиях, геологии, биологии, медицине, металлургии, а также в лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских и учебных организаций.

ОПИСАНИЕ

Микроскоп электронный растровый JSM-7001F представляет собой стационарную автоматизированную многофункциональную измерительную систему.

Микроскоп оснащен катодом с полевой эмиссией холодного типа.

Микроскоп состоит из электронно-оптической системы (колонны), камеры объектов с механизмом перемещения объектов и устройством шлюзования, двух детекторов вторичных и одного детектора отраженных электронов, вакуумной системы, видеоконтрольного устройства, блока электроники.

Вакуумная система включает в себя диффузионный и форвакуумный насосы для откачки рабочей камеры микроскопа и 3 ионных насоса для обеспечения вакуума в катодном узле и электронной колонне.

Микроскоп обеспечивает работу как в режимах регистрации вторичных электронов, так и в режиме регистрации отраженных электронов.

Принцип получения изображения в микроскопе электронном растровом JSM-7001F заключается в модуляции яркости монитора видеоконтрольного устройства сигналами, пропорциональными числу зарегистрированных вторичных электронов, при сканировании сфокусированного электронного зонда по поверхности объекта. Отношение размера изображения на мониторе к размеру растра на образце определяет увеличение микроскопа.

Создание изображения объектов в режиме «Gentle Beam» обеспечивается благодаря торможению первичного пучка полем держателя образца, в результате чего сохраняется возможность наблюдения объекта при пониженных ускоряющих напряжениях с достаточно высоким разрешением.

При работе микроскопа обеспечиваются безопасные условия труда оператора. При максимальных значениях ускоряющего напряжения и тока зонда мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 10 см от поверхности колонны и камеры объектов микроскопа не превышает 1 мкЗв/ч.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Разрешение при ускоряющем напряжении 30кВ, нм.....1,2
2. Эффективный диаметр электронного зонда во вторичных электронах при 15кВ не более, нм.....11
3. Диапазон регулировки увеличения, крат.....10÷500000
4. Диапазон измерения линейных размеров, мкм.....0,05÷1000
5. Пределы относительной погрешности измерений линейных размеров не более, %.....±5
6. Диапазон регулировки ускоряющего напряжения, кВ.....0,2÷30
7. Номинальное напряжение сети питания, В220 (+10/-15%)
8. Максимальная потребляемая мощность, кВ·А3
9. Габаритные размеры основных составных частей не более, мм:
 - электронно-оптическая система.....1125x790x1800
 - операторский стол с компьютером.....1200x1000x700
10. Общая масса без ЗИП и упаковки не более, кг.....800
11. Условия эксплуатации:
 - диапазон температуры окружающего воздуха, °С.....20 ± 2
 - относительная влажность воздуха, %.....50÷80
 - диапазон атмосферного давления, кПа.....84÷107

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус микроскопа и на титульный лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект единичного экземпляра микроскопа электронного растрового JSM-7401F, зав. № SM18550065, входят:

1. Микроскоп электронный растровый JSM-7001F - 1 шт.
2. Комплект ЗИП и расходные материалы - 1 шт.
3. Тест-объекты – образцы островковой пленки золота на углероде - 1шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка микроскопа проводится в соответствии с ГОСТ Р 8.631—2007 «ГСИ. Микроскопы электронные растровые измерительные. Методика поверки»

При поверке применяется мера, изготовленная по ГОСТ Р 8.628—2007 «ГСИ. Меры рельефные нанометрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим формам, линейным размерам и выбору материала для изготовления» и поверенная по ГОСТ Р 8.629—2007 «ГСИ. Меры рельефные нанометрового диапазона с трапецидальным профилем элементов. Методика поверки».

Межповерочный интервал — 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия».
2. ГОСТ Р 51350-99 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Общие требования».
3. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1.799-99 Минздрав России, 2000.
4. Техническая документация фирмы-изготовителя «JEOL», Япония.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

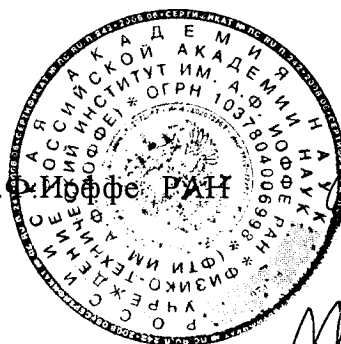
Микроскоп электронный растровый JSM-7001F с зав. № SM18550065 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании и метрологически обеспечен при выпуске из производства и эксплуатации.

Изготовитель – фирма «JEOL», Япония

Заявитель: Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.26. Тел.: (812) 297-2245

Заместитель директора


Физико-Технического Института им. А.Ф.Иоффе РАН



 О.В.Дудник

Заведующий лабораторией

УРАН ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

 С.Г.Конников

Ведущий научный сотрудник

ОАО «НИЦПВ»

 В.Б.Митюхляев